Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO

Service d'accréditation suisse SAS

Registre SCS Numéro d'accréditation : SCS 0136

Norme internationale: ISO/IEC 17025:2017

Norme suisse : SN EN ISO/IEC 17025:2018

Helmut Fischer SA Moosmattstrasse 1 6331 Hünenberg Responsable: Michael Schwarzenberger

Responsable SM: Michael Schwarzenberger

Téléphone: +41 41 785 08 30

E-Mail: <u>michael.schwarzenberger@hel-</u>

mutfischer.com

Internet: <u>www.helmut-fischer.ch</u>

Première accréditation : 09.12.2013

Accréditation actuelle : 09.12.2023 au 08.12.2028

Registre voir: www.sas.admin.ch

(Organismes accrédités)

Portée de l'accréditation dès le 09.12.2023

Laboratoire d'étalonnages dans le domaine des mesures de longueur, d'épaisseur des couches, d'épaisseur des revêtements, de l'analyse des concentrations des éléments et de la conductivité électrique

Capacités d'étalonnage et de mesure (CMC)

Grandeur de mesure / Objet à étalonner	Étendue de mesure	Conditions de mesure	Meilleure incertitude de mesure ± 1)	Remarques
Longueur (épaisseur de revêtements)	0.5 - 500 micro- mètres (µm)	Comparaison avec des matériaux de référence certifiés par microscopie électronique à ba- layage	De 0.5 - 1 μm: 8 % De 1 - 5 μm: 2 % De > 5 μm: 1 %	
	0.5 µm - 100 milli- mètres (mm)	Non destructive par méthodes électro- magnétiques	0.5 μm	

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO Service d'accréditation suisse SAS

Registre SCS

Numéro d'accréditation : SCS 0136

Grandeur de mesure / Objet à étalonner	Étendue de mesure	Conditions de mesure	Meilleure incertitude de mesure ± 1)	Remarques
Épaisseur de revê- tements (masse surfacique)	De 5 nanomètres (nm) à 100 μm	ED-XRF, ICP-OES	1 nm	Étendue et incerti- tude des mesures dépendant du sys- tème des revête- ments spécifiques. Condition d'une densité du matériel de revêtement connu
Fractions mas- siques des élé- ments des solides et liquides	De 10 milligrammes par kilogramme (mg/kg) à 1000 grammes par kilo- gramme (g/kg)	Destructif ou non destructif (ICP-OES, ED-XRF)	5 mg/kg	Étendue et incerti- tude des mesures dépendant de la composition du ma- tériel spécifique
Conductivité élec- trique des solides non-ferreux	0.3 - 63 mégasie- mens par mètre (MS/m),	Méthode des cou- rants de Foucault	1 % relative	
	0.5 -108 % « International An- nealed Copper Standard » (%IACS)			

En cas de contradictions dans les versions linguistiques des registres, la version allemande fait foi.

//*/*